### Confiabilidade em Circuitos Eletrônicos

Abordagem via Parts Stress Analysis

João Pedro Samarino Paulo Cirino Ribeiro Neto Walter Fonseca de Magalhães

### Tópicos

- Circuito Eletrônico
- Modelagem e simulação
- Metodologia
- Modelos de Confiabilidade
- Confiabilidade dos componentes
- Experimentos
- Conclusões

### O Circuito Eletrônico

Amplificador de Áudio
O som é caracterizado por

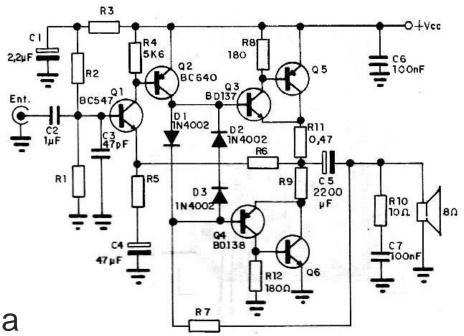
- Intensidade
- Altura
- Timbre

Função do Amplificador

- Fornecer ganho de potência
- Preservar características originais

#### Classe AB

- Rendimento teórico 78,5%
- Ângulo de condução 180°



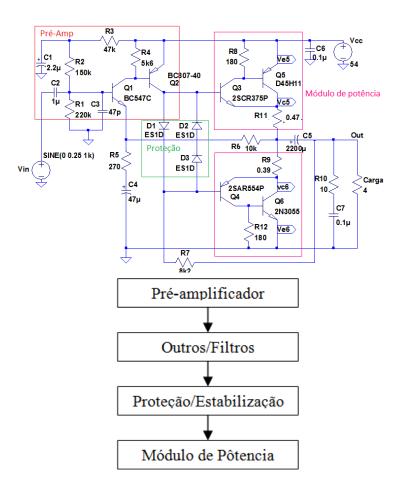
### Modelagem e Simulação

Utilização de software

- MATLAB™ e Simulink™
- LtSpice™

Modelagem e Simulação por Blocos

Limite superior de potência 35 W



### Metodologia

### Parts Stress Analysis

Baseado na norma militar
 MIL-HDBK-217F

$$\lambda_{sys} = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_{g_i}. \pi_{f_i})$$

- Expressa como um somatório

   da contribuição de cada componente
   submetido aos fatores que o caracterizam
- Leva em consideração aspectos físicos e de condição de uso

### Modelo de Confiabilidade

- Utilizado modelo de confiabilidade exponencial
- Componentes modelados
  - Diodos
  - Transistores
  - Resistores
  - Capacitores
- Dados de resistência térmica dos transistores retirados do datasheet

MIL-HDBK-217F CHG NOTICE 2

■ 9999970 0397036 34T ■

#### NOT MEASUREMENT SENSITIVE

MIL-HDBK-217F 2 DECEMBER 1991

SUPERSEDING MIL-HDBK-217E, Notice 1 2 January 1990

#### MILITARY HANDBOOK

### RELIABILITY PREDICTION OF ELECTRONIC EQUIPMENT



THIS HANDBOOK IS FOR GUIDANCE ONLY - DO NOT CITE THIS DOCUMENT AS A REQUIREMENT

AMSC N/A

FSC-RELI

DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution unlimited.

Consession by S

kan eriarian ir 10 lienas laiban kair 1970 — 1960 — 1977 PP Badinas verkaladikansını yina milk basırı 1980 — 1984 —

### Confiabilidade dos Componentes

#### Resistor

$$\lambda_r = \lambda_B \, \pi_P \, \pi_Q \, \pi_E \, \pi_T \, \pi_S$$

#### Diodo

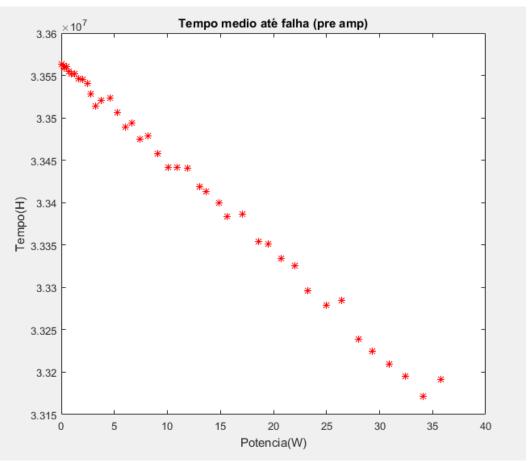
$$\lambda_d = \lambda_B \, \pi_T \, \pi_C \, \pi_V \, \pi_E \, \pi_Q$$

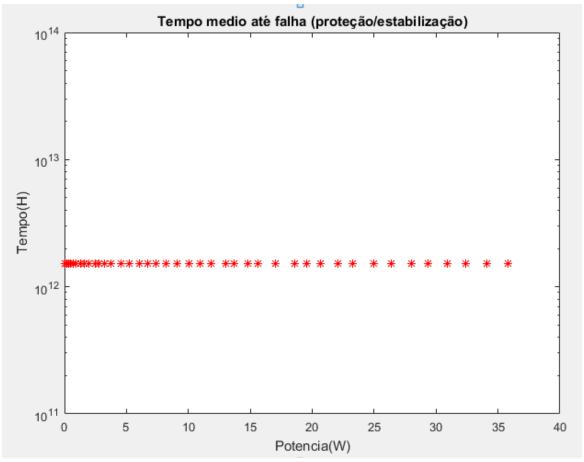
### Capacitor

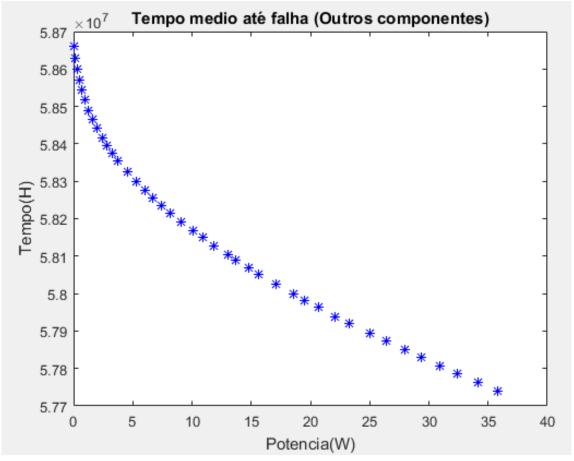
$$\lambda_c = \lambda_B \, \pi_T \, \pi_C \, \pi_V \, \pi_E \, \pi_Q \, \pi_{SR}$$
Transistor

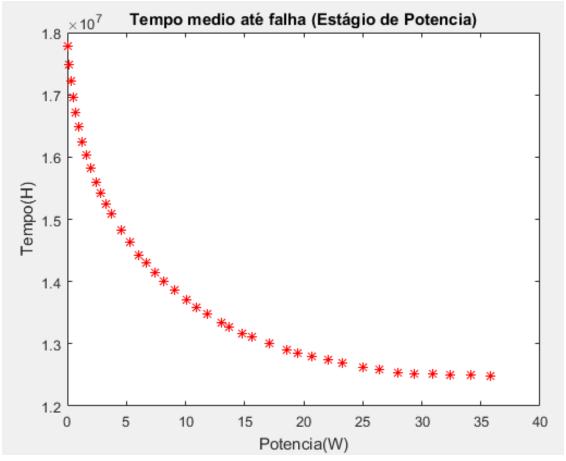
$$\lambda_t = \lambda_B \, \pi_T \, \pi_P \, \pi_S \, \pi_E \, \pi_Q \, \pi_A$$

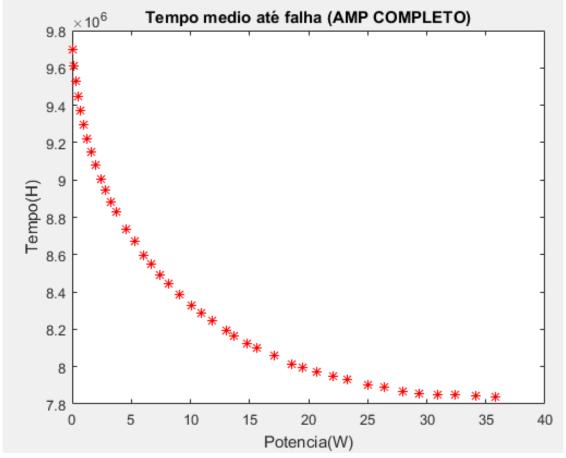
$$R(t) = e^{-\frac{\lambda_p}{10^6}}$$

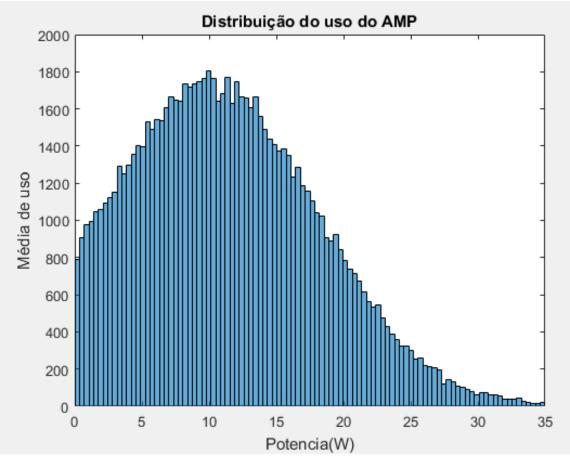


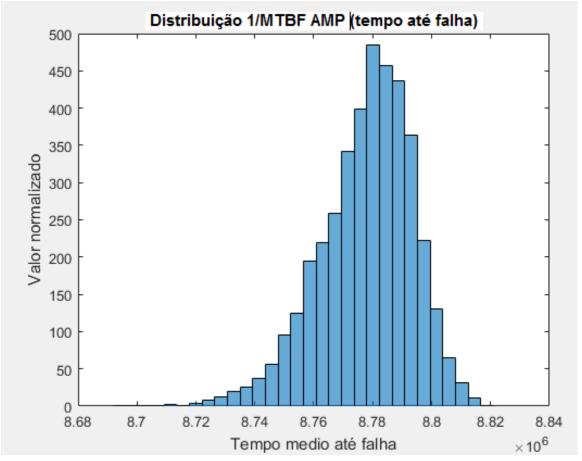


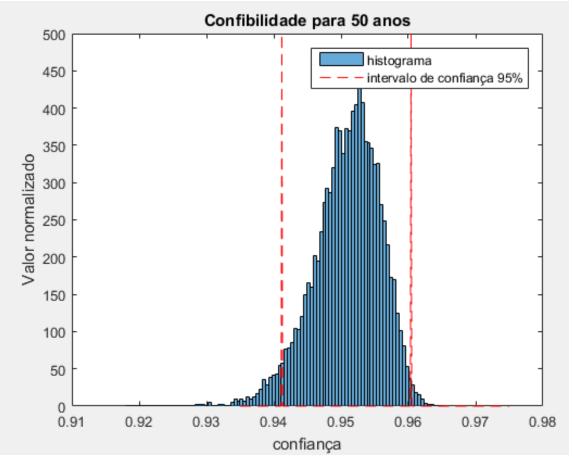






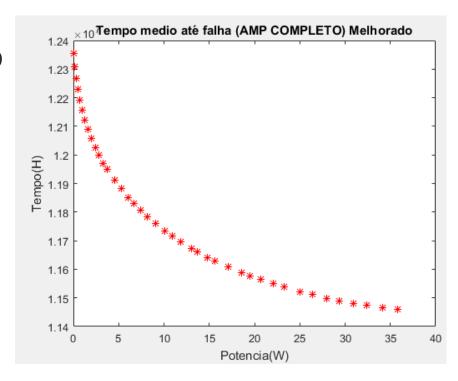






### Proposta de Melhoria

- Transistor com maior capacidade de dissipação
- Temperatura interna do amplificador 35 °C
- Par complementar
  - NJW0281G
  - NJW0302G
  - Resistência térmica de 0,8°C/W



### Conclusão

- Predição da confiabilidade auxilia na redução de custos do projeto
- Embora possua críticas, o MIL-HDBK\_217 continua sendo útil e aplicável (principalmente em circuitos discretos/simples)
- Sistemas mais complexos podem demandar a utilização de mais de uma metodologia de predição da confiabilidade

# Obrigado



